

1. Record Nr.	UNINA9910139855303321
Titolo	2008 17th Asian Test Symposium : 24-27 November 2008
Pubbl/distr/stampa	New York : , : IEEE, , 2008
ISBN	1-5090-8449-5
Descrizione fisica	1 online resource (456 pages)
Soggetti	Fault-tolerant computing Electronic circuits - Testing Electronic digital computers - Circuits - Testing
Lingua di pubblicazione	Inglese
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia